



仪器描述

仪器说明

仪器标签

JEM-3100F具有世界同档次最高分辨率0.17nm。采用最先进的数字化控制系统，操作更简单。应用范围非常广泛。

主要特点：

- 1) 全球同档次最先进的透射电子显微镜
- 2) 实现同档次全球最高分辨率
- 3) 操作更加简单
- 4) 扩展性更强
- 5) 稳定性极高

技术参数：

点分辨率：0.17nm

线分辨率：0.1nm

STEM：0.14nm

电子枪：肖特基式热场发射枪

亮度：7x10<sup>8</sup>A/cm<sup>2</sup>sr以上

束流强度：0.5nA 以上/1nm

放大倍数：x60 - x1,500,000

能谱立体角：0.13sr

© 2005-2009 必和国际贸易(香港)有限公司 版权所有，并保留所有权利。

上海市长乐路989号2006室，邮编：200031，电话：021-60896520,13661956095，<http://www.bihec.cn>, [info@bihec.com](mailto:info@bihec.com)